

01-27-00

17

FRISHAUF, HOLTZ, GOODMAN, LANGER & CHICK, P.C.
ATTORNEYS AT LAW

Express Mail Mailing Label
No.: EL 396 044 919 US

767 THIRD AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017-2023

STEPHEN H. FRISHAUF
LEONARD HOLTZ
HERBERT GOODMAN
WILLIAM R. WOODWARD (1914-1994)
THOMAS LANGER
MARSHALL J. CHICK
RICHARD S. BARTH
DOUGLAS HOLTZ
ROBERT MICHAL
TELEPHONE: (212) 319-4900
FACSIMILE: (212) 319-5101



Date of Deposit: January 24, 2000

I hereby certify that this paper is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231

Barbara Villani



ASST. COMMISSIONER FOR PATENTS
Washington, D.C. 20231

Attorney Docket No. 00037/LH

Transmitted herewith for filing is the **JAPANESE language** patent application of

Inventor(s): Yutaka USAMI
Takashi KOBAYASHI

FILING IN JAPANESE LANGUAGE
37 CFR 1.52(d) AND 1.17(k)

Title: "ELECTRIC NETWORK SIMULATING METHOD, SIMULATING APPARATUS,
AND MEDIUM FOR STORING SIMULATION PROGRAM"

Priority Claim (35 U.S.C. 119) is made, based upon:

Japan No. 11-016823 January 26, 1999

Enclosed herewith are:

- ☒ **JAPANESE LANGUAGE Specification (Description, Claims):** Pages 1 - 27 ; Number of claims 1 - 24
- ☒ **Declaration and Power of Attorney** ☒ **executed**; ☐ **unexecuted** (supplied for information purposes)
- ☒ 10 Sheets of drawings, Figures 1 - 17 ☒ **Formal** ☐ **Informal**
- ☒ **Assignment and "Patents" Recordation Form Cover Sheet (PTO-1595) AND \$40. RECORDATION FEE**
- ☒ **Certified copy (ies) of priority document(s) identified above**
- ☐ **Information Disclosure Statement; ☐ Form PTO-1449**
- ☐ **Preliminary Amendment**
- ☐ **Verified Statement(s) Claiming Small Entity Status**
- ☒ **Receipt Postcard**

	Number Filed		Number Extra	Rate	Calculations
Total Claims	<u> </u> -20 =		<u> </u>	x 18.00 =	\$ <u> </u>
Independent Claims	<u> </u> - 3 =		<u> </u>	x \$78.00 =	\$ <u> </u>
MULTIPLE DEPENDENT CLAIMS				+ \$260.00 =	\$ <u> </u>
NON-ENGLISH SPECIFICATION				BASIC FEE	\$ 690.00 \$ 130.00
				Total of above Calculations	\$ <u>820.00</u>

To the extent not tendered by check, authorization is given to charge any fees under 37 CFR 1.16 and 1.17 during pendency of the application, or to credit any overpayment, to Deposit Account No. 06-1378. Duplicate copy of this letter is enclosed.

FRISHAUF, HOLTZ, GOODMAN, LANGER & CHICK, P.C.

By: *Leonard Holtz*
Leonard Holtz, Reg. No. 22,974

【書類名】 図面

【図 1】

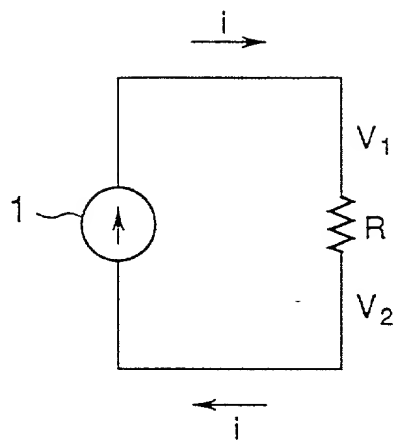


FIG. 1

【図 2】

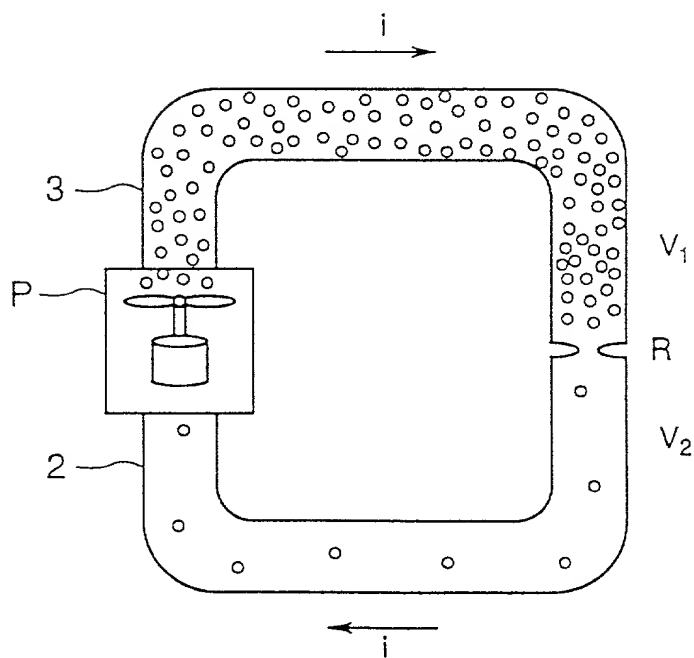
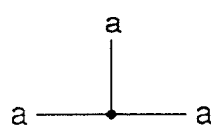


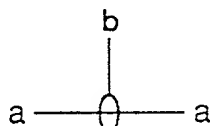
FIG. 2

【図 3】



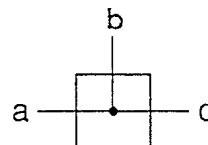
(a)

FIG. 3A



(b)

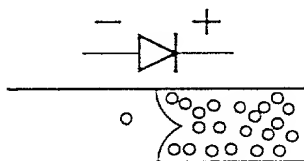
FIG. 3B



(c)

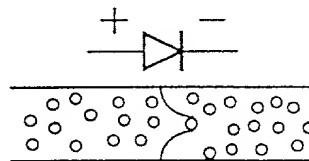
FIG. 3C

【図 4】



(a)

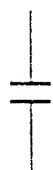
FIG. 4A



(b)

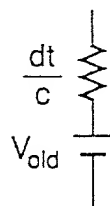
FIG. 4B

【図 5】



(a)

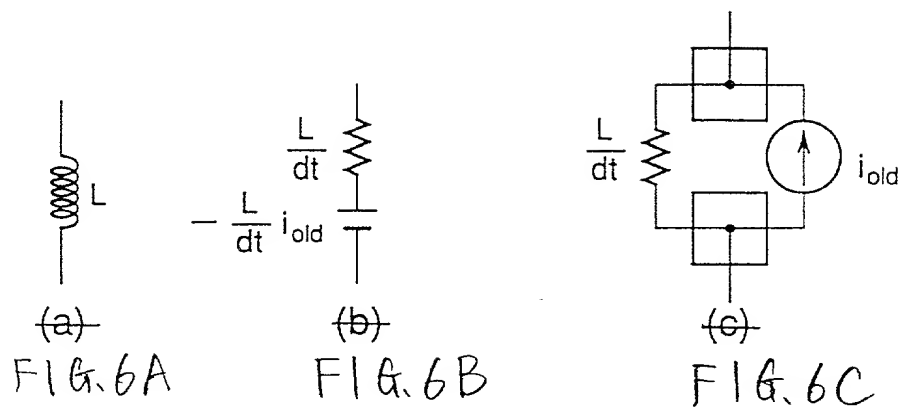
FIG. 5A



(b)

FIG. 5B

【図 6】



【図 7】

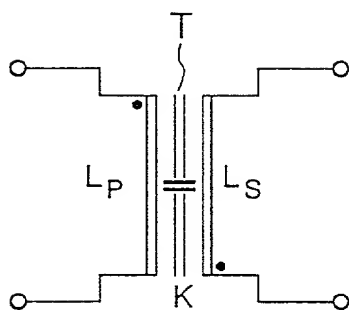


FIG. 7

【図 8】

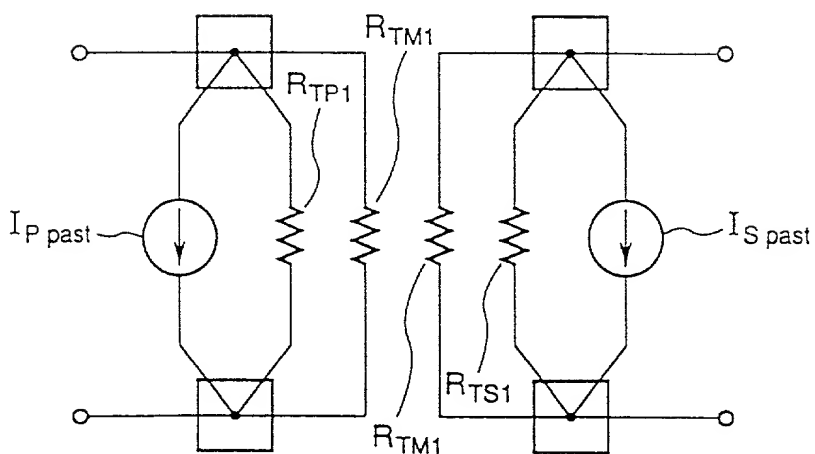


FIG. 8

【圖 9】

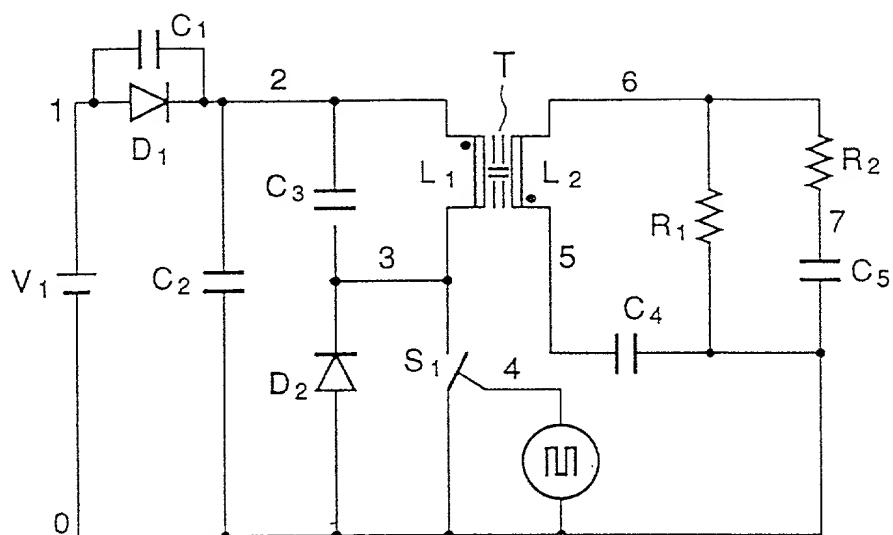
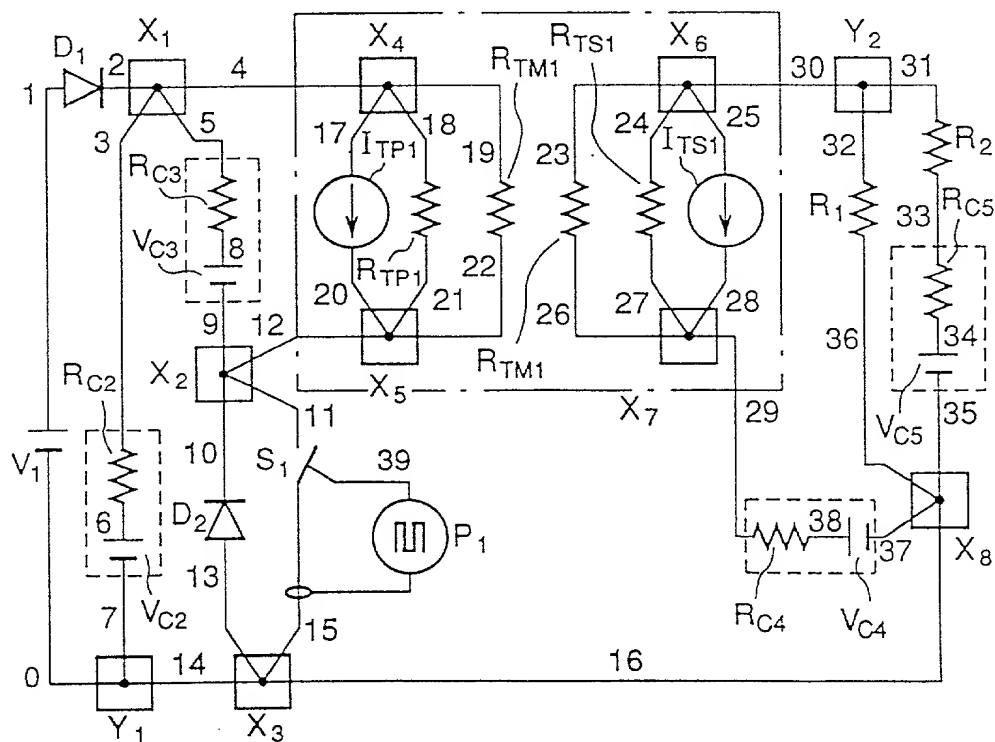


FIG. 9

【圖 10】



F1G. 10

【図 11】

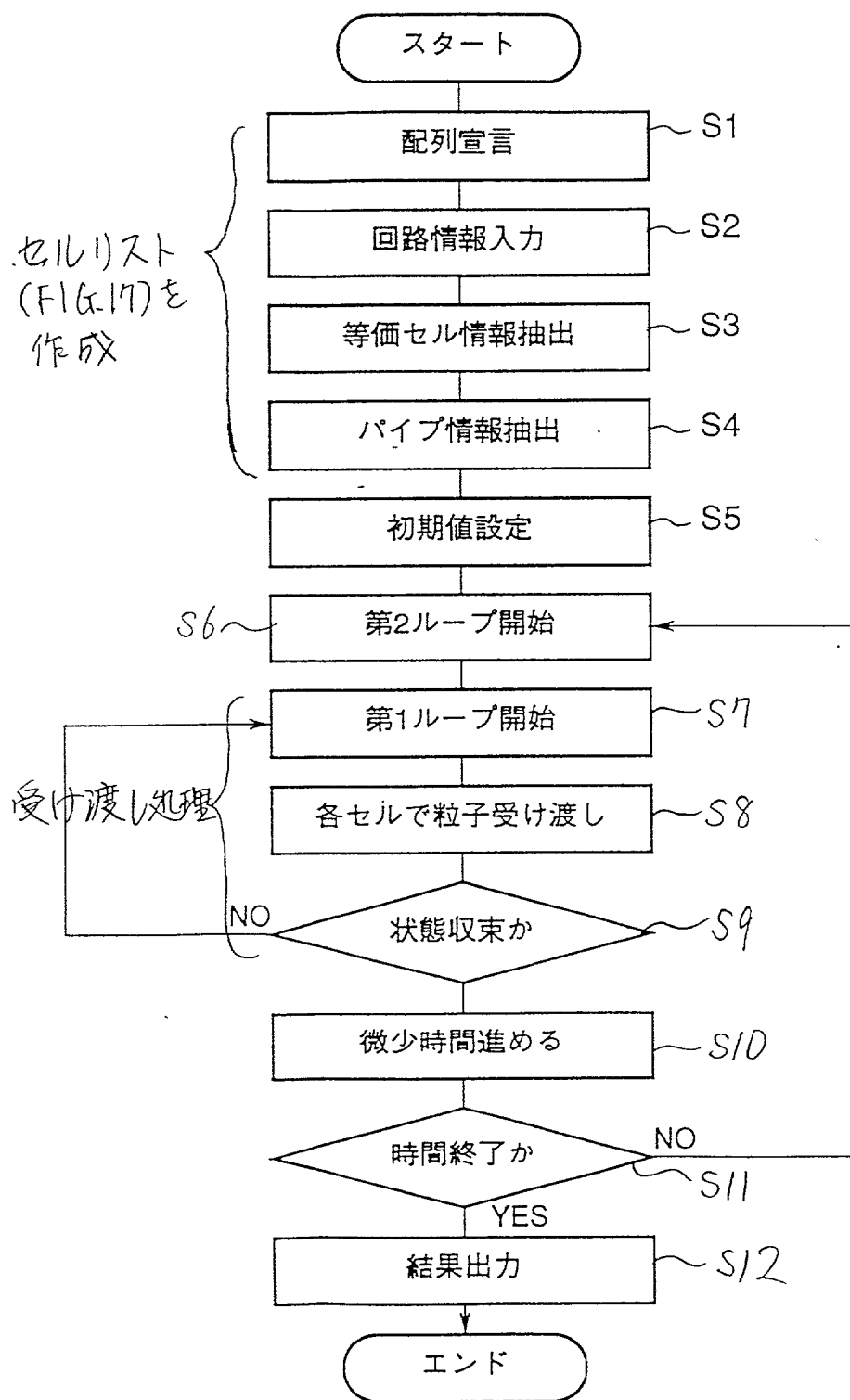


FIG. 11

【図 12】

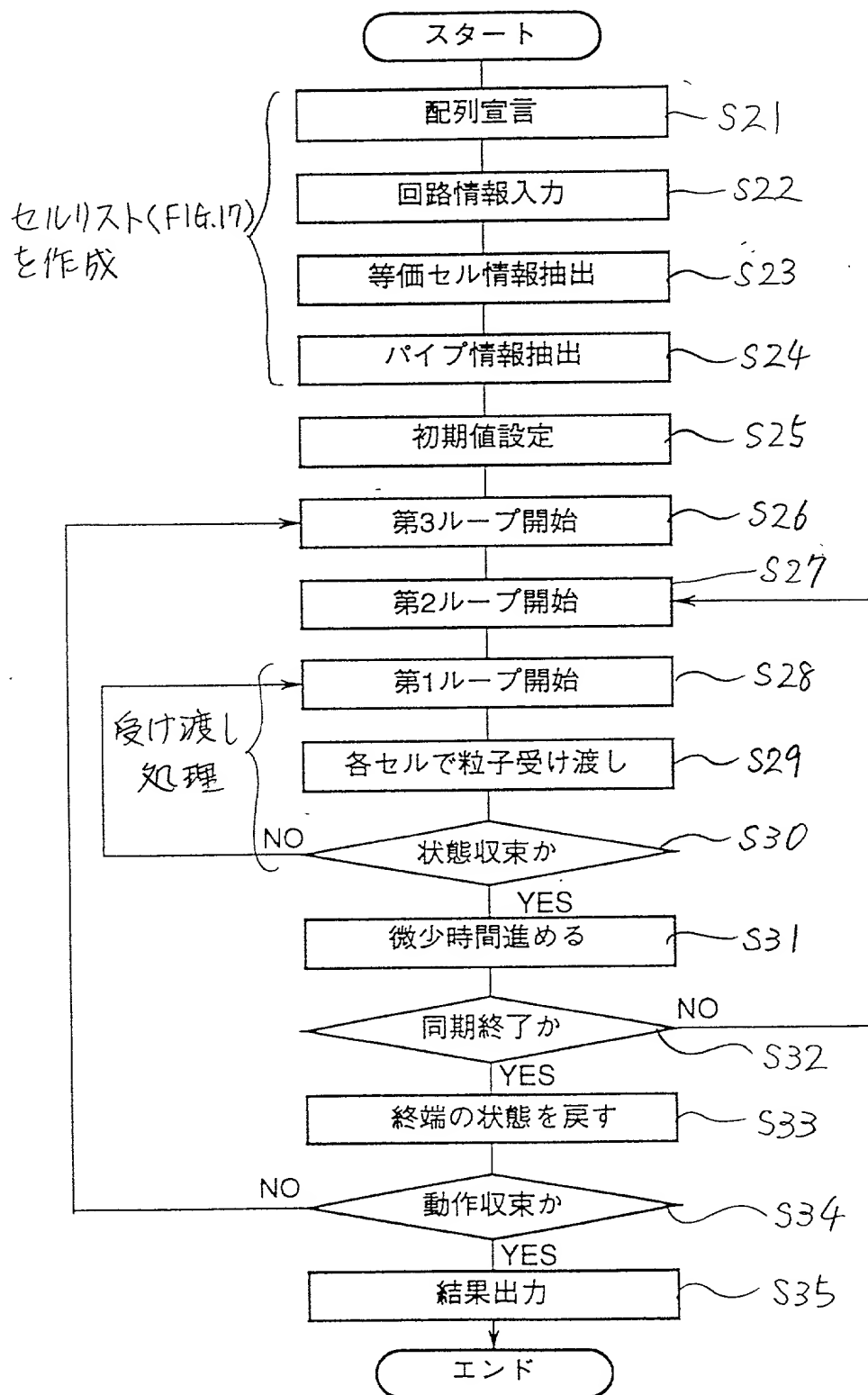


FIG.12

【図 13】

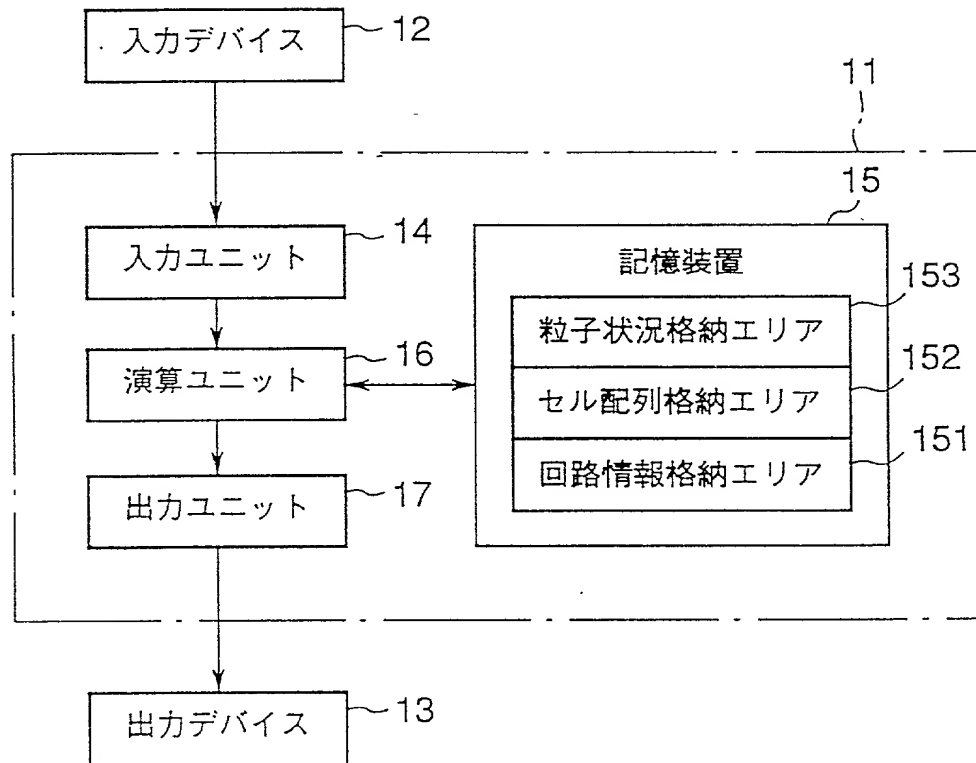


FIG. 13

【図 14】

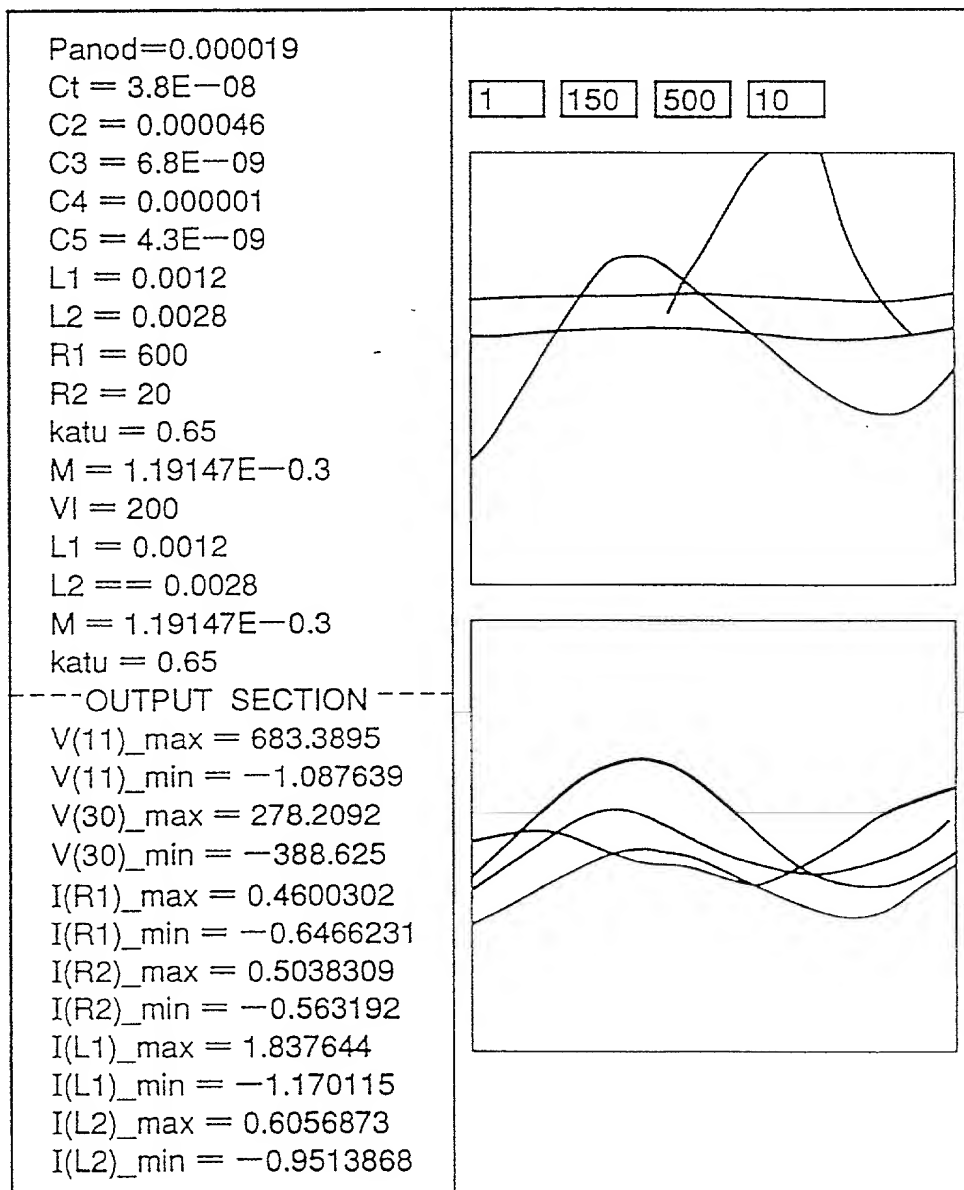


FIG. 14

【図 15】

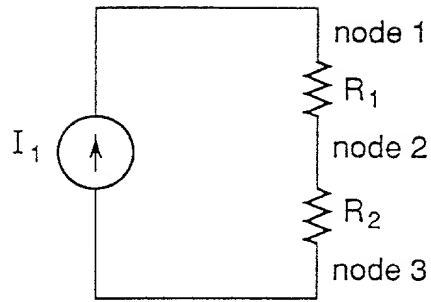


FIG. 15

【図 16】

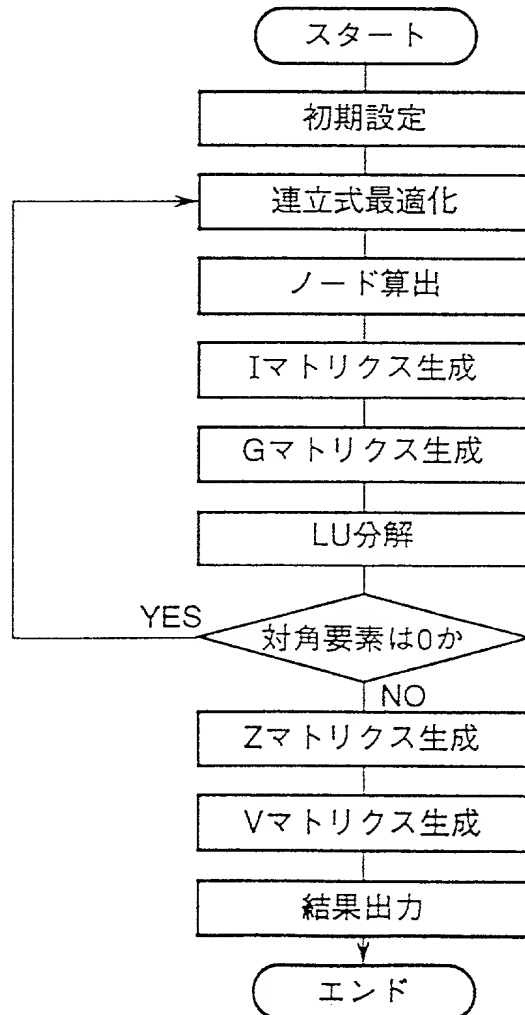


FIG. 16

化学式等を記載した書面

明細書

表1

セルリスト

セル番号	接続ノード番号		固有情報
MES(1)="V1":	NP(1)=1:	NM(1)=0:	DTA(1)=V1
MES(2)="D1":	NP(2)=1:	NM(2)=2:	
MES(3)="X1":	NP(3)=2:	NM(3)=3:	N3(3)=4: N4(3)=5
MES(4)="X2":	NP(4)=9:	NM(4)=10:	N3(4)=11: N4(4)=12
MES(5)="Y1":	NP(5)=0:	NM(5)=7:	N3(5)=14
MES(6)="R _{C2} ":	NP(6)=3:	NM(6)=6:	DTA(6)=dt/C2
MES(7)="V _{C2} ":	NP(7)=6:	NM(7)=7:	DTA(7)=0
MES(8)="X1":	NP(8)=2:	NM(8)=3:	N3(8)=4: N4(8)=5
MES(9)="R _{C3} ":	NP(9)=5:	NM(9)=8:	DTA(9)=dt/C3
MES(10)="V _{C3} ":	NP(10)=8:	NM(10)=9:	DTA(10)=0
MES(11)="V2":	NP(11)=13:	NM(11)=10:	
MES(12)="S1":	NP(12)=11:	NM(12)=15:	N3(12)=39: N4(12)=15: DAT(12)=1
MES(13)="X3":	NP(13)=13:	NM(13)=14:	N3(13)=15: N4(13)=16
MES(14)="P1":	NP(14)=39:	NM(14)=15:	DAT(14)=50: DAT2(14)=0: DAT3(14)=223
MES(15)="X4":	NP(15)=4:	NM(15)=17:	N3(15)=18: N4(15)=19
MES(16)="X5":	NP(16)=12:	NM(16)=20:	N3(16)=21: N4(16)=22
MES(17)="R _{PM} ":	NP(17)=18:	NM(17)=21:	DAT(17)=L1*(1- ketu^* ketu)/dt
MES(18)="R _{PM} ":	NP(18)=23:	NM(18)=26:	DAT(18)=(L1*L2- ketu^* ketu)/(ketu^* dt)
MES(19)="I _{PM} ":	NP(19)=20:	NM(19)=17:	DAT(19)=0
MES(20)="X6":	NP(20)=23:	NM(20)=24:	N3(20)=25: N4(20)=30
MES(21)="X7":	NP(21)=26:	NM(21)=27:	N3(21)=28: N4(21)=29
MES(22)="R _{TS} ":	NP(22)=24:	NM(22)=27:	DAT(22)=L2*(1- ketu^* ketu)/dt
MES(23)="R _{TM} ":	NP(23)=19:	NM(23)=22:	DAT(23)=(L1*L2- ketu^* ketu)/(ketu^* dt)
MES(24)="I _{TS} ":	NP(24)=28:	NM(24)=25:	DTA(24)=0
MES(25)="Y2":	NP(25)=30:	NM(25)=31:	N3(25)=32
MES(26)="R1":	NP(26)=32:	NM(26)=36:	DAT(26)=R1
MES(27)="R2":	NP(27)=31:	NM(27)=33:	DAT(27)=R2
MES(28)="X8":	NP(28)=35:	NM(28)=36:	N3(28)=37: N4(28)=16
MES(29)="R _S ":	NP(29)=33:	NM(29)=34:	DTA(29)=dt/C5
MES(30)="V _S ":	NP(30)=34:	NM(30)=35:	DTA(30)=0
MES(31)="R _α ":	NP(31)=29:	NM(31)=38:	DTA(31)=dt/C4
MES(32)="V _α ":	NP(32)=38:	NM(32)=37:	DTA(32)=0
new_i=32			

DECLARATION FOR PATENT APPLICATION

99S1055

As a below named inventor, I declare:
that I verily believe myself to be the original, first and sole (if only one individual inventor is listed below) or an original, first and joint inventor (if more than one individual inventor is listed below) of the invention in

ELECTRIC NETWORK SIMULATING METHOD, SIMULATING APPARATUS,
AND MEDIUM FOR STORING SIMULATION PROGRAM

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked.

☐ was filed on _____ as United States Application
or PCT International Application No. _____, and
was amended on _____ (if applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
I acknowledge the duty to disclose information of which is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.
I hereby claim foreign priority benefits under 35 U.S.C. 119(a)-(d) or 365 (b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 35 U.S.C. 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

<u>Country</u>	<u>Category</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filing Date</u>	<u>Priority Claim</u>
Japan	Patent	11-016823	January 26, 1999	Yes

And I hereby appoint Leonard Holtz (Reg.No. 22,974), Herbert H. Goodman (Reg.No. 17,081), Thomas Langer (Reg.No. 27,264), Marshall J. Chick (Reg.No. 26,853), Richard S. Barth (Reg.No. 28,180), Douglas Holtz (Reg.No. 33,902) and Robert P. Michal (Reg.No. 35,614) each of whose address is 767 Third Avenue - 25th Floor, New York, N.Y. 10017-2023, or any one of them, my attorneys with full power of substitution and revocation, to prosecute this application and to transact all business in the Patent & Trademark Office connected therewith, and request that correspondence be directed to Frishauf, Holtz, Goodman, Langer & Chick, P.C., 767 Third Avenue - 25th Floor, New York, N.Y. 10017-2023.

I declare further that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

DECLARATION FOR PATENT APPLICATION

I declare further that my citizenship, residence and post office address are as stated below next to my name:

Inventor: (Signature)

Date

Residence and post office address

Yutaka Usami
Yutaka Usami

Date: January 12, 2000

Citizen of: Japan

3-71-1, Tachibana, Ohitocho,
Tagata-gun, Shizuoka-ken, Japan

Date: January 12, 2000

Citizen of: Japan

1-2-31, Kunikubo, Fuji-shi,
Shizuoka-ken, Japan

Takashi Kobayashi
Takashi Kobayashi

Date:

Citizen of: Japan

Date:

Citizen of: Japan

Date:

Citizen of: Japan

Date:

Citizen of: Japan

Date:

Citizen of: Japan

Date:

Citizen of: Japan

TITLE OF THE INVENTION

ELECTRIC NETWORK SIMULATING METHOD, SIMULATING
APPARATUS, AND MEDIUM FOR STORING SIMULATION PROGRAM

BACKGROUND OF THE INVENTION

本発明は、電気回路網を設計する場合等において、回路網の動作状況を事前に把握するためのシミュレーション方法及びシミュレーション装置並びにシミュレーションプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体に関する。

従来の電気回路網の解き方は、例えば、FIG. 15に示すように、電流源 I_1 に抵抗素子 R_1 、 R_2 を直列に接続した回路において、各素子が接続するノード $node_1 \sim node_3$ の電圧を求める場合、この回路の電流、電圧式をマトリクスで示すと、(1)式に示すようになる。なお、 G は抵抗 R の逆数でコンダクタンスを意味している。

【数1】

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ -I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2 & -G_2 \\ 0 & -G_2 & G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \quad \dots (1)$$

このマトリクスを簡単に $I = GV$ と表現するものとして、 I 、 G のマトリクスが与えられたときに V マトリクスを結果として算出するという数学的問題に置き換えることができる。ここで、上記マトリクスに対して、 G を LU 分解して $I = LU V$ と変形する。なお、 LU マトリクスとは、(2)式に示す要素を持つ下三角行列、上三角行列からなるものとする。

【数2】

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & U_{12} & U_{13} \\ 0 & 1 & U_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots (2)$$

もし、 $I = LZ$ を満たすような Z マトリクスが存在すると、 $LZ = LU V$ が成り立つので、この両辺から L を消去して $Z = UV$ が得られる。そして、もし、 Z が既知であれば V を求めることができる。

LU分解したときのL、Uマトリクスの一般項は(3)式で表現でき、また、Zマトリクスは(4)式で表現でき、また、最終解のVマトリクスは(5)式で表現できる。これらを順に解いていけば、正しい解を得ることができる。

【数3】

$$\left[\begin{array}{l} \left[L_{im} = G_{im} - \sum_{j=1}^{m-1} L_{ij} U_{jm} \right]_{i=m, \dots, n} \\ \left[U_{mj} = (G_{mj} - \sum_{k=1}^{m-1} L_{mk} U_{kj}) / L_{mm} \right]_{j=m+1, m+2, \dots, n} \end{array} \right] \dots (3)$$

$$\left[Z_i = (I_i - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik} Z_k) / L_{ii} \right]_{i=1, 2, \dots, n} \dots (4)$$

$$\left[V_{n-i} = Z_{n-i} - \sum_{k=n-i+1}^n U_{n-i, k} V_k \right]_{i=0, 1, 2, \dots, n-1} \dots (5)$$

FIG. 16は、従来技術のフローチャートを示し、基本的には前述した内容をそのままアルゴリズム化したものである。ここで注意しなければならないのは、Uマトリクスを算出するときにLの対角要素で割り算をしていることである。Lの対角要素とは、 L_{11} 、 L_{22} 、 L_{33} 、…であり、ここにどのような値（但し、ゼロも含む）が来るかは回路を記述したGマトリクスに依存する。

もし、回路が抵抗素子だけで抵抗値が変化しないならば、Gマトリクスの値も確定しているので、Lの対角要素がゼロにならないようにすることは可能である。FIG. 16では、もし、対角要素がゼロになった場合には、条件分岐してGマトリクスの要素の順序を変えるようにしている。

ところで、もし、Rの値が変化するような素子であったとして、そのインピーダンス値が回路の状況によって変化するものであったとすると、事前にLマトリクスの対角要素がゼロにならないという保障がなくなってしまう。このため、実際のアルゴリズムでは、対角要素がゼロにならないことを常に監視する必要がある。

また、対角要素がゼロでなくとも限りなくゼロに近い値がセットされたとすると、有限ビット数で表現される数値計算では割り算による誤差が発生し、以降の計算結果に多大な計算誤差を発生させる危険性がある。特に、素子の両端電圧や電流の微分項が分母になる場合、例えば、ある時刻における電圧から微小時間前の電圧を減算した値が分母となるような計算項目があったとすると、素子の両端にかかる電圧は事前に分かるものではなくてシミュレーションを実行してはじめて分かるものである。従って、この分母がどのような値になるかは全く未知ということになり、微分係数がゼロの場合、すなわち、微小時間前の電圧値と現在の電圧値がゼロ又は限りなくゼロに近い値になってしまった場合には、数値誤差によって計算結果が精度の落ちたものになってしまい、これ以降の計算を続けても事実上意味を為さない結果になってしまう。従って、ゼロでなくとも有効桁数を常に監視するアルゴリズムが必要となる。

これらの問題は、マトリクスを解くという方法である以上、避けることはできない。従って、基本的な解法の実思想は簡素であっても、これらの問題を解決するためのアルゴリズムが必要となり、全体としては冗長な演算になってしまうという問題がある。

BRIEF SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は、回路動作をパイプ内の粒子の移動としてとらえることにより、回路動作を比較的簡単なアルゴリズムで確実にシミュレーションすることができる回路網のシミュレーション方法、シミュレーション装置及びシミュレーションプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体を提供する。

本発明は、複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと、配線上の電氣的交点の機能を表わす交点セルと、the 素子セルと the 交点セルとの接続を表わす接続パイプとを設定し、更に、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間あたりに移動する粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義工程；と、the 定義工程の定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定し、更に the 交点セルに接続した接続パイプ内に存在する粒子数が均等になり、かつ、the 交点セルでの受け渡しの粒子数の

総和がゼロになるべく予めルールを the 交点セル毎に設定する設定工程；と、the 設定工程にて設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間及び the 交点セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡工程；と、the 受渡工程によって the 接続パイプでの単位時間当たりには通過する粒子数とその the 接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡処理と更新処理とを 1 回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシュミレート工程；とを有する回路網のシュミレーション方法である。

本発明のシュミレーション方法は、上述したように、従来のように回路網をシュミレートするために連立方程式を解くのではなく、回路網を粒子の流れとして捉えるものである。このため、回路を、回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと、配線上の電氣的交点の機能を表わす交点セルと、the 素子セルと the 交点セルとの接続を表わす接続パイプとに置き換えて、定義し直す。そして、the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定する。そしてこのルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間及び the 交点セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う。こうすることで、各接続パイプにおける粒子の数と移動量、すなわち、電圧と電流とが一義的に決定される。原理的には、このように、電流や電圧を全て粒子の量や動きとして捉え直し、又更に、コイルやコンデンサ、更にスイッチや半導体素子等の能動素子についても、これらを抵抗素子や電圧源、電流源などの基本的素子へ等価的に置き換え可能なので、この考え方により、接続する接続パイプの粒子の相対量と単位時間の移動量を求めることでシュミレートするものである。こうすることにより、従来の連立方程式では原理的に発生してしまう誤差や遠大な処理時間に煩わせることなく、大規模な回路網に対しても迅速で正確なシュミレート結果を得ることが可能となる。

又更に本発明は、上述したようなシュミレート方法だけに限るものではなく、この方法を実践するシュミレート装置、及び、コンピュータ装置にインストールされて同等のシュミレート方法を実践するコンピュータプログラムを格納した記録媒体にも及ぶものである。それぞれは、同等の趣旨により、従来の連立方程式を解く方法では得られなかった、処理速度の向上と高精度なシュミレーション結

果を得ることが可能となる。

Additional objects and advantages of the invention will be set forth in the description which follows, and in part will be obvious from the description, or may be learned by practice of the invention. The objects and advantages of the invention may be realized and obtained by means of the instrumentalities and combinations particularly pointed out hereinafter.

BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWING

The accompanying drawings, which are incorporated in and constitute a part of the specification, illustrate presently preferred embodiments of the invention, and together with the general description given above and the detailed description of the preferred embodiments given below, serve to explain the principles of the invention.

FIG. 1 は、本発明の実施の形態における電気回路例を示す図；

FIG. 2 は、FIG. 1 の回路例をパイプを通る粒子モデルとして示す図；

FIG. 3 A, 3 B, 3 C は、電気回路の交点及び同実施の形態における接続パイプを参照するモデル、交点セルのモデルを示す図；

FIG. 4 A, 4 B は、同実施の形態におけるダイオードセルのモデルを示す図；

FIG. 5 A, 5 B は、コンデンサ及び同実施の形態におけるコンデンサの等価モデルを示す図；

FIG. 6 A, 6 B, 6 C は、インダクタ及び同実施の形態におけるインダクタの等価モデルを示す図；

FIG. 7 は、リーケージトランスを示す図；

FIG. 8 は、同実施の形態におけるリーケージトランスの等価モデルを示す図；

FIG. 9 は、半波電圧共振インバータの回路構成図；

FIG. 10 は、同実施の形態における半波電圧共振インバータの等価モデルを示す図；

FIG. 1 1 は、同実施の形態における過渡解析処理を示すフローチャート；
FIG. 1 2 は、同実施の形態における周期解析処理を示すフローチャート；
FIG. 1 3 は、同実施の形態におけるシミュレーション装置の構成を示すブロック図；
FIG. 1 4 は、同シミュレーション装置での出力例を示す図；
FIG. 1 5 は、従来の電気回路網の解き方を説明するための回路図；
FIG. 1 6 は、同電気回路網の演算処理を示すフローチャート； and
FIG. 1 7 は、本発明の実施形態に係るセルリストを示す図である。

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

FIG. 1 は電流源 1 に抵抗 R を接続した閉ループ回路で、抵抗 R の両端にはそれぞれ電圧 V_1 と V_2 が発生し、前記電流源 1 からは電流 i が供給されている。これに相当する粒子モデルを示すと FIG. 2 に示すようになる。

この粒子モデルでは、電流源 1 をポンプ P に置き換え、このポンプ P は単位時間当たり所定の粒子を下のパイプ 2 から拾って上のパイプ 3 に出すという機能を果たす。また、抵抗 R に相当する機能は上のパイプ 3 から下のパイプ 2 への粒子の通りにくさとして表現する。前記パイプ 2, 3 の内容積を説明を簡単にするために単位体積とする。これにより、パイプ 2, 3 中の粒子の数はそのまま粒子密度を表わすことになる。

この粒子密度を電圧に見立てて、単位時間当たりの粒子の移動数を電流と見立てれば、抵抗 R に相当する部分での粒子の通りにくさは物理量として表現することができる。具体的に示すと、例えば、電流源 1 が 1 アンペア、抵抗 R が $100\ \Omega$ とすると、抵抗 R の両端に発生する電位差は 100 V となる。これに相当するものとして、1 アンペアを粒子 1000 個で表現し、抵抗 R はそのまま通りにくさの度合い 100 として表現する。

これにより、均衡した状態では、抵抗 R の両端には粒子数として $1000 \times 100 = 100000$ 個分の差が生じることになる。なお、粒子の個数は必ずしも正である必要はなく、ゼロあるいは負の数であってもかまわない。結果的に必要なのは、抵抗 R の両端の個数差だけとなる。

FIG. 3 Aは電気回路における配線の結線を示し、一般的な電気回路では交点は単なる結線であり、素子としての認識はない。また、交点でのノードは全てaで共通であり、回路上は区別していない。

これに対し、粒子モデルでは、FIG. 3 Cに示すように、交点を素子と同じ機能セルとして扱い、交点セルに接続するノードは全て異なる。すなわち、a, b, cの3つの名称のノードが存在する。そして、この交点セルにおいては、接続する3つのパイプに対して、それぞれのパイプに内在する粒子数を平均化し、その時の粒子の移動数が総和としてゼロとなるように取り決める。

なお、交点において、電圧、電流を参照するのみであれば、FIG. 3 Bに示すように、粒子が移動するパイプとこれを参照するパイプの組み合わせとして表現することもできる。

FIG. 4 Aと FIG. 4 Bとはダイオードの機能を模した素子セルを示しており、この素子セルは接続する2端子に極性を持ち、例えば、FIG. 3 Aに示すように、カソードを+極性、アノードを-極性としたときには、カソード側のパイプの粒子数がアノード側のパイプの粒子数より多ければ粒子の移動は起こらず、逆に、FIG. 3 Bに示すように、カソードを-極性、アノード+極性としたときには、アノード側の粒子数が多くなれば粒子はスムーズにアノード側からカソード側へ移動できるものとする。

このような機能を素子セルとして記述しておけば整流作用としてのダイオード特性を得ることができる。なお、もう少し厳密なダイオード特性が必要であれば、例えば、接合容量、接合電位、温度係数、降伏電圧などであるが、これらの要素を含む任意の関数としてセルを定義してもよい。また、1つの素子セルとして記述するのが冗長であれば、より根源的な線形素子の組み合わせとしてダイオードの詳しい記述を行ってもよい。

次に、コンデンサ素子をモデル化する場合について述べると、コンデンサは一般的に(6)式で示すように、両端電圧 V を電流の積分式として表現できる。これを有限の微小時間で区切った領域の総和と考えれば、積分記号は Σ 関数として表記でき、これを微小時間前の両端電圧 $V_{i,d}$ と電流の1次項として表現できる。

【数4】

$$v = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{dt}{C} \sum i = v_{old} + \frac{dt}{C} i \quad \dots (6)$$

これは電流と電圧の線形式であるから、 v_{old} という電圧源と dt/C という抵抗成分を持つことを意味し、これをより根源的な線形素子に分解して等価的に表現すれば、FIG. 5 Aに示すコンデンサ C は、FIG. 5 Bに示すように、抵抗素子 dt/C と電圧源 v_{old} の直列接続として表現できる。

このコンデンサ素子を含む計算は、ある時刻 t における計算をしているわけで、時刻 t より微小時間前の動作状態はすでに確定している。従って、時刻 t における計算をする上で v_{old} は固定値の電圧源と見なすことができる。抵抗成分についても微小時間区分 dt は既知であり、コンデンサ容量 C も既知であるから、これも固定値である。従って、時刻 t におけるコンデンサの挙動はこれらの根源的な素子で表現できる。

次に、インダクタ素子をモデル化する場合について述べると、インダクタは、(7)式で示すように、コンデンサと同様左辺を V で記述してもよいが、その場合には右辺は電流の微分項となる。これでも計算は可能であるが、十分に収束していない場合の電流値は不正確であり、不正確な電流に対して微分を適用することは好ましくない場合がでて来る。

そこで、(8)式で示すように、左辺に電流を持って来て、右辺を電圧の積分の形にする。こうすると、時刻 t における電流は、FIG. 6 Bに示すように、微小時間前の電流値 $L/dt \times i_{old}$ と抵抗値 L/dt の抵抗に流れる電流の和であるから、これをより根源的な素子で表現すれば、FIG. 6 Aに示すインダクタ L は、FIG. 6 Cに示すように、抵抗素子 L/dt と電流源 i_{old} の並列接続として表現できる。

【数5】

$$v = L \frac{di}{dt} = \frac{L}{dt} i - \frac{L}{dt} i_{old} \quad \dots (7)$$

$$i = \frac{1}{L} \int v dt = \frac{dt}{L} \sum v = i_{old} + \frac{dt}{L} v \quad \dots (8)$$

FIG. 7 はリーケージトランス T の一般的な表記である。このトランス T におい

ては、 L_p と L_s という2つのインダクタが磁気結合しており、その結合の度合いは結合係数 k で表現している。このトランス T の1次側と2次側で成り立つ関係式は、(9)式、(10)式、(11)式に示す通りである。なお、 M_{ps} は相互インダクタンスを示している。

【数6】

$$V_p = L_p \frac{di_p}{dt} + M_{ps} \frac{di_s}{dt} \quad \dots (9)$$

$$V_s = L_s \frac{di_s}{dt} + M_{ps} \frac{di_p}{dt} \quad \dots (10)$$

$$M_{ps} = k\sqrt{L_p L_s} \quad \dots (11)$$

上記(9)式、(10)式、(11)式をインダクタの場合と同じ発想で変形すると、(12)式及び(13)式が得られる。 i_{ppast} 、 i_{spast} はそれぞれ微小時間前の1次側、2次側に流れる電流を示している。 V_p 、 V_s はそれぞれ時刻 t における1次側、2次側の両端電位差を示している。

【数7】

$$i_p = i_{ppast} + \frac{dt}{L_p(1-k^2)} V_p - \frac{Mdt}{L_p L_s - M_{ps}^2} V_s \quad \dots (12)$$

$$i_s = i_{spast} + \frac{dt}{L_s(1-k^2)} V_s - \frac{Mdt}{L_p L_s - M_{ps}^2} V_p \quad \dots (13)$$

この式を根源的な素子セルで置き換えたものが FIG. 8 のモデルである。すなわち、このモデルは、電流源セル I_{ppast} 、 I_{spast} 、抵抗セル R_{TP1} 、 R_{TS1} 、 R_{TM1} 、 R_{TM1} 及び交点セルの組合わせで表現できる。

次に回路図をどのように認識するかについて説明する。

FIG. 9 は1石式半波電圧共振インバータ回路であり、このインバータ回路は、直流電源 V_1 にダイオード D_1 とコンデンサ C_1 との並列回路を介してコンデンサ C_2 を接続し、このコンデンサ C_2 に、リーケージトランス T の1次側 L_1 とコンデンサ C_3 との並列回路とスイッチ S_1 との直列回路を接続している。そして、前記スイッチ S_1 にダイオード D_2 を逆極性にして並列に接続して半波スイッチ回路を形成している。

前記トランスTの2次側L2にコンデンサC4を介して負荷回路R1を接続し、その負荷回路R1に抵抗R2とコンデンサC5との直列回路を並列に接続している。

このインバータ回路は、直流電源V1を入力とし、コンデンサC3と1次側L1の並列共振回路をスイッチS1とダイオードD2からなる半波スイッチ回路で開閉することによって並列共振を持続させ、その共振エネルギーの一部をトランスTのリーケージ成分によって2次側に伝達し、負荷回路R1を駆動する。

このインバータ回路を前述した素子セルで置き換えると、FIG. 10に示すような等価セル図面になる。すなわち、コンデンサC2は抵抗素子 R_{C2} と電圧源 V_{C2} の直列接続となり、コンデンサC3は抵抗素子 R_{C3} と電圧源 V_{C3} の直列接続となり、コンデンサC4は抵抗素子 R_{C4} と電圧源 V_{C4} の直列接続となり、コンデンサC5は抵抗素子 R_{C5} と電圧源 V_{C5} の直列接続となる。また、リーケージトランスTは、電流源セル I_{TP1} 、 I_{TS1} 、抵抗セル R_{TP1} 、 R_{TS1} 、 R_{TM1} 、 R_{TM1} 及び交点セルX4、X5、X6、X7の組合わせで表現している。

図中Y1、Y2は3本のパイプが交わる交点セルで、X1、X2、…X8は4本のパイプが交わる交点セルを意味している。これらはパイプの交わる本数が異なるだけで内部での処理の方法は同一である。スイッチS1はダイオードと同じように導通か非導通かの機能として表現しており、制御端子に印加されている電圧（粒子数）で判断している。制御端子にはパルス電源P1が接続しており、その基準電位は参照セル（参照すべきパイプ中の粒子数を参照するためのセル）によりノード15の粒子数を参照し、この粒子数に所定のパルス電圧分の粒子数を加算したものをスイッチ制御用電圧としている。ノード名はFIG. 9では交点の周りで同一だったものが、FIG. 10では全て別のノードとして付け直しているののでFIG. 9ではノード0～7であるが、FIG. 10ではノード0～39となっている。

このような等価セル構成を入力する情報としてFIG. 17に示す配列を定義する。このFIG. 17においてNME\$は素子セル又は交点セルに付けられた名称を格納する配列で、名称の最初の1文字がセルの属性を示している。また、配列のインデックスは「1」で始まり、セルの個数分だけある。ここではセルの総数が32個なので、インデックスは「32」まで存在する。

これらの本発明に必要なセル（素子セル及び交点セル）をセルリストとして FIG. 17 に示す。

FIG. 17 のセルリストによれば、NP、NM はセルが接続するノード番号を格納する配列である。また、素子が 2 端子ではなく、それ以上の端子数となる場合には、NP、NM に続いて N3、N4、…Nn という配列を使用する。ダイオードなどのように極性を有する素子の場合にはこの極性記述が重要となる。抵抗などのように極性を解くに有しない場合にはこの極性は特に意味を持たないが便宜上同じ書き方とする。DTA はセルの持つ固有情報を格納する配列であり、電圧源であればその電圧値を記入し、抵抗素子であればその抵抗値を記入し、交点セルなどのように特に固有情報を必要としない場合には記載しない。コンデンサ、インダクタ、リーケージトランスなどのように、より根源的な等価セルの組として表現されている場合にはそれぞれの等価セルがセルの固有情報を記載する。この場合の固有情報は前述した等価式から得ることができる。

最後に記されている new_i は、セルの個数分だけループさせるための変数である。なお、パイプの中に存在する粒子数は、V(i) という配列に保存し、単位時間に通過する粒子数は、II(i) という配列に保存する。ここでの i はセルの番号ではなく、パイプのノード番号である。従って、パイプの数だけ V、II 配列は存在することになる。インダクタやコンデンサなどを含む解析に際して、初期値が必要な場合には、この V、II 配列の初期データとして前述した(6)～(8)式による変換で得られる値をセットする。

次にセルにおける粒子の受け渡し処理のプログラムの実例を示す。例えば、R で始まる抵抗セルの場合には、次のように記述する。

Case” R”

```
V_temp=V(NP(i),t_cell)-V(NM(i),t_cell)
```

```
i_temp=V_temp/DTA(i)
```

```
V(NP(i),t_cell)=V(NP(i),t_cell)-i_temp
```

```
V(NM(i),t_cell)=V(NM(i),t_cell)+i_temp
```

ここで、V は前述の粒子数を記憶する配列である。今度はさらに時間に関する次元も取り入れて V(i,t) としたとき、i はパイプに付けられたノード番号を示し

ており、前述の配列NM\$(i)\$で定義した new_i のループの順番に相当する番号ではない。t は計算する時の時刻に相当するステップ数を示している。もし、定常解を得るだけであれば、t の項は不要であり、過渡解析をするのであれば、t が微小時間毎に更新することになる。

従って、ここでいう $V(NP(i), t_cell)$ は、正極ノード配列 $NP(i)$ が示すパイプにおける時間ステップ数 t_cell の時の粒子数を示している。同様に、 $V(NM(i), t_cell)$ は、負極ノード配列 $NM(i)$ が示すパイプにおける粒子数であり、これらの差を取った V_temp は抵抗セルの両端のパイプの粒子数差、すなわち、電位差を表わしている。抵抗セルの場合にはDTA配列には抵抗値が入力されているから、このとき流れるべき電流に相当する粒子流は、 $i_temp = V_temp / DTA(i)$ として表現できる。抵抗セルにおいては、正極端子から粒子が流入し、負極端子から同数の粒子が出て行くので、両端のパイプの粒子数からそれぞれ i_temp に相当する数を増減させる。以上が抵抗としてのセルの機能である。

また、ダイオードセルは、単純に順方向へ電流を流し、逆方向へは全く流さないという整流作用だけを持たせたセルで、順方向へ流すときのPN接合電位に相当する電圧を定義する。

Case” D”

$V_temp = V(NP(i), t_cell) - V(NM(i), t_cell)$

If $V_temp > 0.7$ Then

$V(NP(i), t_cell) = V(NP(i), t_cell) - V_temp/2$

$V(NM(i), t_cell) = V(NM(i), t_cell) + V_temp/2$

End if

ここで、 V_temp は前述したものと同じでダイオードセルにかかっている電位差を計算している。 $NP(i)$ をダイオードのアノード側、 $NM(i)$ をカソード側と定義してあれば、 V_temp はアノード→カソードの方向で見た電位差になるから、これは順方向電圧に相当する。そして、順方向電圧が0.7ボルト以上になったら、粒子が移動するものとして、移動する粒子の数は $V_temp/2$ とする。この粒子数は素子の両端で同じでなくてはならないから、アノード側からこの数を引き、カソード側へ足すように記述する。なお、順方向電圧が0.7ボルト以下の場合に

はダイオードは遮断されるので、粒子の移動は全く伴わない。従って、粒子の移動を記述する必要がない。

また、交点セルは、例えば、3端子の場合には次のようになる。電気回路の場合には交点において、電圧が共通になるとともに出入りする電流の総和がゼロであることの両方を満たさなくてはならない。これは連立式を解く上で必須である。しかし、ここでは、交点セルで記述すべき機能は、接続するパイプ間で粒子数が共通になるということだけである。この交点セルを機能させれば、平衡した状態においては結果として出入りする粒子流（単位時間当たりの粒子数）の総和はゼロとなる。つまり、この粒子モデルでは、粒子数（電圧）が基本的な物理量であって、粒子流（電流）は従属的な物理量であることが判る。

Case" Y"

$$V_temp=(V(NP(i),t_cell)+V(NM(i),t_cell)+V(N3(i),t_cell))/3$$

$$V(NP(i),t_cell)=V_temp$$

$$V(NM(i),t_cell)=V_temp$$

$$V(N3(i),t_cell)=V_temp$$

電流源セルは、定常状態において一定の電流が流れている状況を再現すればよいので、単位時間当たりの粒子数を両端のパイプに出入りさせればよい。セルのスキャンループを単位時間当たり何回行かうかということと電流値は比例関係にあるので、DTA配列に入るべき値は電流値の係数倍となる。最も判りやすい方法は、DTA配列に電流値そのものを入れて、スキャンループは単位時間当たり1回行くと定義することである。

Case" I"

$$V(NP(i),t_cell)=V(NP(i),t_cell)+DTA(i)$$

$$V(NM(i),t_cell)=V(NM(i),t_cell)-DTA(i)$$

次に、これらのセルを使った解析のアルゴリズムについて述べる。

FIG. 11は、過渡解析の例を示すフローチャートで、プログラムを実行すると、S1にて、配列宣言、すなわち、必要な配列や変数などのメモリ空間を確保し、次に、S2にて、解析したい回路の情報を入力する。ここで入力する回路情報は、一般的な電気回路のサーキットデータとする。

イス 13 としては、モニタ画面表示するディスプレイや印刷出力するプリンタ等がある。

前記シミュレーションユニット 11 は、前記入力デバイス 12 からの回路接続情報を内部処理に適した情報に変換して取込む入力ユニット 14、この入力ユニット 14 からの情報を記憶装置 15 の回路情報格納エリア 151 に書き込み、この書き込んだ情報をもとに等価的なセルのモデルを構築し、その情報をセル配列格納エリア 152 に保存し、また、これらのセルに接続するパイプ内の粒子数や粒子が単位時間に動いた数などを粒子状況格納エリア 153 に逐次記憶するとともにこの格納エリア 153 に初期値をセットするなどの演算処理を行う演算ユニット 16 及びこの演算ユニット 16 の演算結果を前記出力デバイス 13 に適したフォーマットに変換する出力ユニット 17 を備えている。

このような構成のシミュレーション装置を使用して回路動作のシミュレーションを行ったときのモニター画面による出力例を示すと、FIG. 14 に示すようになる。この出力例は、FIG. 9、FIG. 10 及び FIG. 17 に示す回路構成のものを FIG. 12 に示す周期解析のフローチャートに従ってシミュレートした結果を示している。画面の左側には入力した回路素子の定数をリスト出力し、画面の右側にはスイッチ周期における見たいノードの電圧、電流波形を表示している。そして、収束判定するための条件を右側上部の 4 つの窓に表示している。

このようなシミュレーション装置を使用することで、回路の動作状況が分かり易く、また、回路の設計を効率良く行うことができる。すなわち、回路動作を基本的にはパイプ内の粒子の移動としてとらえているので、演算の内容は足し算か引き算であり、割り算が存在しないので、アルゴリズムの本質としてオーバーフローを引き起こすことはない。これにより、どのような回路構成、回路素子の組合わせであっても、途中で計算を中断することなく、所定の時間範囲のシミュレーションを実行することができる。

なお、パイプに関しては足し算、引き算のみであるが、素子セルに関しては素子の機能によっては割り算が含まれる。例えば、抵抗素子を表わす素子セルの記述では、電流に相当する粒子の移動量を計算するときに抵抗値による割り算を行っている。もし抵抗値にゼロがセットされていれば同じようにオーバーフローと

なるが、抵抗値がどのような値かは事前に知ることができ、また、適切な処理も簡単に施せる。すなわち、素子セルの記述さえ確実に行っておけばよく、シミュレーションの方法自体から切り離して考えることができる。

なお、フロッピディスクや光磁気ディスク等の記録媒体に、回路接続情報のみでなく、前記シミュレーションユニット11が行うシミュレーション処理のプログラム自体も格納し、最初にシミュレーションユニット11が記録媒体からシミュレーション処理のプログラムを読み込んでから回路接続情報を読み込んで回路動作のシミュレーションを実行するということもできる。

以上説明したように本発明によれば、回路動作をパイプ内の粒子の移動としてとらえることにより、回路動作を比較的簡単なアルゴリズムで確実にシミュレーションすることができる回路網のシミュレーション方法を提供できる。

更に本発明によれば、回路動作をパイプ内の粒子の移動としてとらえることにより、回路動作を比較的簡単なアルゴリズムで確実にシミュレーションすることができる回路網のシミュレーション装置を提供できる。

更に本発明によれば、コンピュータに、回路動作を比較的簡単なアルゴリズムで確実にシミュレーションさせることができるシミュレーションプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体を提供できる。

WHAT IS CLAIMED IS:

1. 回路網のシュミレーション方法 comprising the steps of:

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと各回路素子をつなぐ配線を表わす接続パイプとを定義し、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間当りに移動する粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義工程；

the 定義工程の各定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定する設定工程；

the 設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡工程； and

the 受渡工程によって the 接続パイプでの単位時間当りに通過する粒子数とその接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡工程と更新処理とを1回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシュミレート工程.

2. 回路網のシュミレーション方法 comprising the steps of:

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと、配線上の電氣的交点の機能を表わす交点セルと、the 素子セルと the 交点セルとの接続を表わす接続パイプとを設定し、更に、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間当りに移動する粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義工程；

the 定義工程の定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定し、更に the 交点セルに接続した接続パイプ内に存在する粒子数が均等になり、かつ、the 交点セルでの受け渡しの粒子数の総和がゼロになるべく予めルールを the 交点セル毎に設定する設定工程；

the 設定工程にて設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間及び the 交点セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡工程； and

the 受渡工程によって the 接続パイプでの単位時間当りに通過する粒子数

とその the 接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡処理と更新処理とを1回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシュミレート工程。

3. 回路網のシュミレーション方法 according to one of claims 1 and 2, wherein the 設定工程 includes

the 回路素子が電流源であるとき、この回路素子を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの the 接続パイプのうち、一方の接続パイプから単位時間当たりに電流値に相当する粒子数を取り出し、他方の接続パイプに同数の粒子を与えるルールを設定する工程。

4. 回路網のシュミレーション方法 according to one of claims 1 and 2, wherein the 設定工程 includes

the 回路素子が電圧源であるとき、この回路素子を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの the 接続パイプのうち、一方の接続パイプの粒子数と他方の接続パイプの粒子数の差が the 電圧源の電圧に相当する粒子数に等しくなるようにルールを設定する工程。

5. 回路網のシュミレーション方法 according to one of claims 1 and 2, wherein the 定義工程 includes

the 回路素子が時間に対して非線形を有するとき、電流源を表現する素子セルと電圧源を表現する素子セルとのどちらか一方と、the 回路素子のある時刻の挙動に等価な線形性を表現する抵抗素子の素子セルとの組み合わせとして、the 回路素子を定義する工程；

and the 設定工程 includes

the 電流源を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの接続パイプのうち、一方の接続パイプから単位時間当たりに電流値に相当する粒子数を取り出し、他方の接続パイプに同数の粒子を与えるルールを設定する工程； and

the 電圧源を表現する素子セルに、その素子セルに接続した2つの接続パイプのうち、一方の接続パイプの粒子数と他方の接続パイプの粒子数の差を the 電圧源の電圧に相当する粒子数に等しくするルールを設定する工程。

6. 回路網のシュミレーション方法 according to one of claims 1 and 2, wherein the 設定工程 includes

the 回路素子が不連続に変化するインピーダンス特性をもつとき、この回路素子表現する the 素子セルのための複数の the ルールを用意し、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて複数の the ルールから一つの the ルールを選択する工程。

7. 回路網のシュミレーション方法 according to claim 5, wherein the 受渡工程と制御工程 includes

the 時間に対して非線形を有する回路素子の過渡現象をシュミレートするべく、初期の時刻における the 各素子セルの状態をシミュレートし、次に微小時間進んだときの非線形素子の動作点における挙動を the 各素子セルと等価な機能をもった the 素子セルの組合せの各パラメータを変更することでシュミレートし、更にこの変更を微小時間進める毎に繰返すことによりシュミレートする工程。

8. 回路網のシュミレーション方法 according to claim 6, wherein the 受渡工程と制御工程 includes

the 不連続に変化するインピーダンス特性をもつ回路素子の過渡現象をシュミレートするべく、初期の時刻における各素子セルの挙動をシミュレートし、次に微小時間進んだときの非線形素子の動作点における挙動を the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて選択された the ルールに応じて受渡工程を行うことでシュミレートし、更にこれを微小時間進める毎に繰返すことによりシュミレートする工程。

9. 回路網のシュミレーション装置 comprising:

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと各回路素子をつなぐ配線を表わす接続パイプとを定義し、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間当たりに移動する粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義手段；

the 定義手段の各定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能表現するルールを予め the 素子セル毎に設定する設定手段；

the 設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡手段； and

the 受渡手段によって the 接続パイプでの単位時間あたりに通過する粒子数とその接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡手段と更新処理とを1回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシュミレート手段。

10. 回路網のシュミレーション装置 comprising:

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと、配線上の電氣的交点の機能を表わす交点セルと、the 素子セルと the 交点セルとの接続を表わす接続パイプとを設定し、更に、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間あたりに移動する粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義手段；

the 定義手段の定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定し、更に the 交点セルに接続した接続パイプ内に存在する粒子数が均等になり、かつ、the 交点セルでの受け渡しの粒子数の総和がゼロになるべく予めルールを the 交点セル毎に設定する設定手段；

the 設定手段にて設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間及び the 交点セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡手段； and

the 受渡手段によって the 接続パイプでの単位時間あたりに通過する粒子数とその the 接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡処理と更新処理とを1回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシュミレート手段。

11. 回路網のシュミレーション装置 according to one of claims 9 and 10, wherein the 設定手段 includes

the 回路素子が電流源であるとき、この回路素子を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの the 接続パイプのうち、一方の接続パイプから単位時間あたりに電流値に相当する粒子数を取出し、他方の接続パイプに同数の粒子を与えるルールを設定する手段。

12. 回路網のシュミレーション装置 according to one of claims 9 and 10, wherein the 設定手段 includes

the 回路素子が電圧源であるとき、この回路素子を表現する the 素子セルに、

その素子セルに接続した2つの the 接続パイプのうち、一方の接続パイプの粒子数と他方の接続パイプの粒子数の差が the 電圧源の電圧に相当する粒子数に等しくなるようにルールを設定する手段。

13. 回路網のシュミレーション方法 according to one of claims 9 and 10, wherein the 定義手段 includes

the 回路素子が時間に対して非線形を有するとき、電流源を表現する素子セルと電圧源を表現する素子セルとのどちらか一方と、the 回路素子のある時刻の挙動に等価な線形性を表現する抵抗素子の素子セルとの組合わせとして、the 回路素子を定義する手段；

and the 設定手段 includes

the 電流源を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの接続パイプのうち、一方の接続パイプから単位時間当たりに電流値に相当する粒子数を取り出し、他方の接続パイプに同数の粒子を与えるルールを設定する手段； and

the 電圧源を表現する素子セルに、その素子セルに接続した2つの接続パイプのうち、一方の接続パイプの粒子数と他方の接続パイプの粒子数の差を the 電圧源の電圧に相当する粒子数に等しくするルールを設定する手段。

14. 回路網のシュミレーション装置 according to one of claims 9 and 10, wherein the 設定手段 includes

the 回路素子が不連続に変化するインピーダンス特性をもつとき、この回路素子を表現する the 素子セルのための複数の the ルールを用意し、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて複数の the ルールから一つの the ルールを選択する手段。

15. 回路網のシュミレーション装置 according to claim 13, wherein the 受渡手段と制御手段 includes

the 時間に対して非線形を有する回路素子の過渡現象をシュミレートするべく、初期の時刻における the 各素子セルの状態をシミュレートし、次に微小時間進んだときの非線形素子の動作点における挙動を the 各素子セルと等価な機能をもった the 素子セルの組合せの各パラメータを変更することでシュミレートし、更にこの変更を微小時間進める毎に繰返すことによりシュミレートする手段。

16. 回路網のシュミレーション装置 according to claim 14, wherein the 受渡手段と制御手段 includes

the 不連続に変化するインピーダンス特性をもつ回路素子の過渡現象をシュミレートするべく、初期の時刻における各素子セルの挙動をシミュレートし、次に微小時間進んだときの非線形素子の動作点における挙動を the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて選択された the ルールに応じて受渡手段を行うことでシュミレートし、更にこれを微小時間進める毎に繰返すことによりシュミレートする手段、

17. コンピュータ装置に読み込まれて起動するシュミレーションプログラムを格納する記録媒体であり、the プログラムは the コンピュータ装置を起動させて以下の手段を生じさせる、

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと各回路素子をつなぐ配線を表わす接続パイプとを定義し、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間当たりに移動する粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義手段；

the 定義手段の各定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定する設定手段；

the 設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡手段； and

the 受渡手段によって the 接続パイプでの単位時間当たりに通過する粒子数とその接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡手段と更新処理とを1回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシュミレート手段、

18. コンピュータ装置に読み込まれて起動するシュミレーションプログラムを格納する記録媒体であり、the プログラムは the コンピュータ装置を起動させて以下の手段を生じさせる、

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと、配線上の電氣的交点の機能を表わす交点セルと、the 素子セルと the 交点セルとの接続を表わす接続パイプとを設定し、更に、回路網の電流を the 接続パイプで単位時間当たりに移動す

る粒子数として定義し、回路網の電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義する定義手段；

the 定義手段の定義に基づき、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定し、更に the 交点セルに接続した接続パイプ内に存在する粒子数が均等になり、かつ、the 交点セルでの受け渡しの粒子数の総和がゼロになるべく予めルールを the 交点セル毎に設定する設定手段；

the 設定手段にて設定したルールに従って、the 素子セルと the 接続パイプとの間及び the 交点セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う受渡手段； and

the 受渡手段によって the 接続パイプでの単位時間あたりに通過する粒子数とその the 接続パイプ内の粒子数を更新し、この受渡処理と更新処理とを1回以上行うことにより回路網の状態をシミュレートするシミュレート手段。

19. シミュレーションプログラムを格納する記録媒体 according to one of claims 17 and 18, wherein the 設定手段 includes

the 回路素子が電流源であるとき、この回路素子を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの the 接続パイプのうち、一方の接続パイプから単位時間あたりに電流値に相当する粒子数を取り出し、他方の接続パイプに同数の粒子を与えるルールを設定する手段。

20. シミュレーションプログラムを格納する記録媒体 according to one of claims 17 and 18, wherein the 設定手段 includes

the 回路素子が電圧源であるとき、この回路素子を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した2つの the 接続パイプのうち、一方の接続パイプの粒子数と他方の接続パイプの粒子数の差が the 電圧源の電圧に相当する粒子数に等しくなるようにルールを設定する手段。

21. シミュレーションプログラムを格納する記録媒体 according to one of claims 17 and 18, wherein the 定義手段 includes

the 回路素子が時間に対して非線形を有するとき、電流源を表現する素子セルと電圧源を表現する素子セルとのどちらか一方と、the 回路素子のある時刻の挙

動に等価な線形性を表現する抵抗素子の素子セルとの組合わせとして、the 回路素子を定義する手段；

and the 設定手段 includes

the 電流源を表現する the 素子セルに、その素子セルに接続した 2 つの接続パイプのうち、一方の接続パイプから単位時間当たりに電流値に相当する粒子数を取り出し、他方の接続パイプに同数の粒子を与えるルールを設定する手段； and

the 電圧源を表現する素子セルに、その素子セルに接続した 2 つの接続パイプのうち、一方の接続パイプの粒子数と他方の接続パイプの粒子数の差を the 電圧源の電圧に相当する粒子数に等しくするルールを設定する手段。

22. シミュレーションプログラムを格納する記録媒体 according to one of claims 17 and 18, wherein the 設定手段 includes

the 回路素子が不連続に変化するインピーダンス特性をもつとき、この回路素子を表現する the 素子セルのための複数の the ルールを用意し、the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて複数の the ルールから一つの the ルールを選択する手段。

23. シミュレーションプログラムを格納する記録媒体 according to claim 22, wherein the 受渡手段と制御手段 includes

the 時間に対して非線形を有する回路素子の過渡現象をシュミレートするべく、初期の時刻における the 各素子セルの状態をシミュレートし、次に微小時間進んだときの非線形素子の動作点における挙動を the 各素子セルと等価な機能をもった the 素子セルの組合せの各パラメータを変更することでシュミレートし、更にこの変更を微小時間進める毎に繰返すことによりシュミレートする手段。

24. シミュレーションプログラムを格納する記録媒体 according to claim 23, wherein the 受渡手段と制御手段 includes

the 不連続に変化するインピーダンス特性をもつ回路素子の過渡現象をシュミレートするべく、初期の時刻における各素子セルの挙動をシミュレートし、次に微小時間進んだときの非線形素子の動作点における挙動を the 素子セルに接続している the 接続パイプの状態に応じて選択された the ルールに応じて受渡手段を行うことでシュミレートし、更にこれを微小時間進める毎に繰返すことにより

シュミレートする手段.

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

複数の回路素子の電氣的機能を表わす素子セルと各回路素子をつなぐ配線を表わす接続パイプとを定義し、電流を the 接続パイプで単位時間当たりに移動する粒子数、電圧を the 接続パイプ内に存在する粒子数として定義し、the 接続パイプの状態に応じて the 各回路素子の電氣的機能を表現するルールを予め the 素子セル毎に設定し、これに従って the 素子セルと the 接続パイプとの間の粒子の受け渡しを行う。そして、the 接続パイプでの単位時間当たりに通過する粒子数とその接続パイプ内の粒子数とから回路網の状態をシミュレートする回路網のシュミレーション方法。